

imq-Ingenieurbetrieb
für Materialprüfung, Qualitätssicherung
und Schweißtechnik GmbH

Bereich Entwicklung/Beratung

**Restschmutz – Analyse
Auswertung von Partikelfiltern**



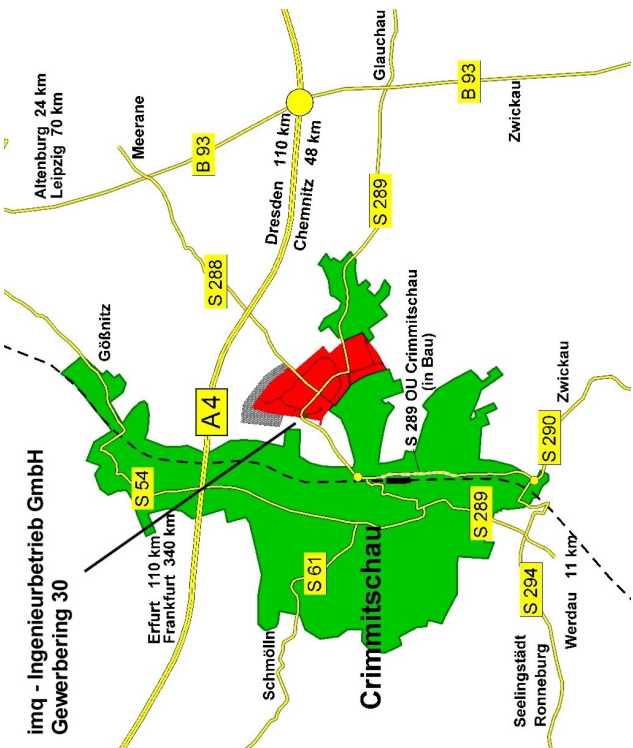
DIN EN ISO/IEC 17025 Akkreditiertes Prüflabor
DAP – PL – 2435.99

Ihr Geschäftspartner in Sachen

- ✓ Charakterisierung von Oberflächen
 - ✓ Technische Sauberkeit
-

Tel: (0 37 62) 95 37 - 0
Fax: (0 37 62) 95 37 – 22
www.imq-gmbh.com
info@imq-gmbh.com

Hier finden Sie uns:



08451 Crimmitschau, Gewerbering 30

**Brief/Telefax–Antwort
Fax: (0 37 62) 95 37–22**

Firma/Stempel:

imq-Ingenieurbetrieb
für Materialprüfung, Qualitätssicherung und
Schweißtechnik GmbH

Bereich Entwicklung/ Beratung

Name:

Ich interessiere mich für weitere
Informationen zu:

Telefon/E-Mail:

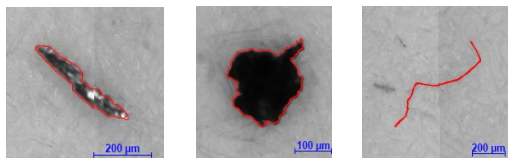
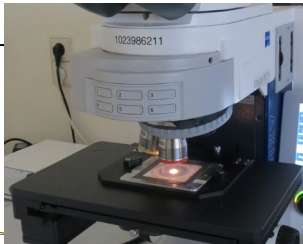
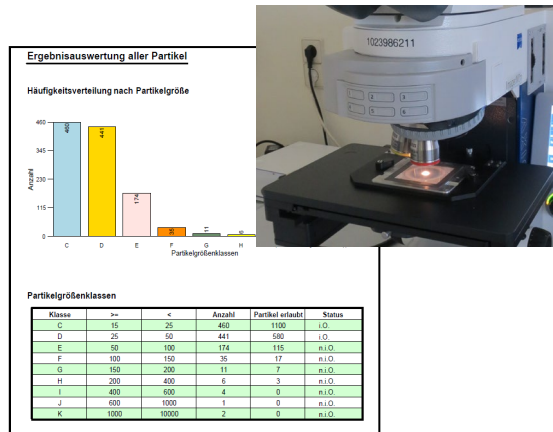
Datum, Unterschrift:

Restschmutz – Analyse Auswertung von Partikelfiltern

Auswertung von Partikelfiltern gemäß
VDA 19 / ISO 16232

Auszählen am Lichtmikroskop

- Auflicht – Mikroskop
- Reproduzierbare Parametereinstellung, individuelle Anpassung der Schwellwerte
- Klassifizierung nach Anzahl, Größe, Art und Form
- Unterscheidung von reflektierenden, nicht reflektierenden Partikeln und Fasern
- Festlegung von Bewertungsklassen
- Anpassung der Bewertung und Dokumentation nach Ihren Vorgaben

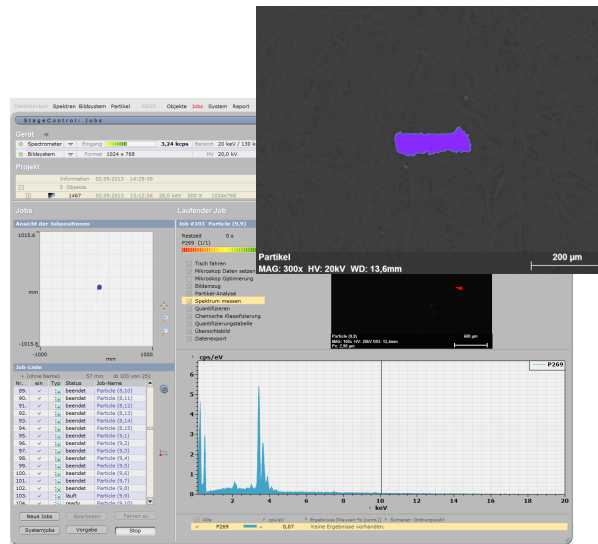


Chemische Elementanalyse Bewertung der Schadhafteigkeit

Auswertung von Partikelfiltern gemäß
ISO 16232 – Teil B

Vollautomatische EDX - Analyse

- Rasterelektronenmikroskop mit EDX
- Reproduzierbare Parametereinstellung, individuelle Anpassung der Schwellwerte
- Bestimmung der Morphologie (Klassifizierung nach Anzahl, Größe, Art und Form)
- Vollständiges Scannen Partikel zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung nach Norm
- Definition von spezifischen Materialgruppen
- Anpassung der Bewertung und Dokumentation nach Ihren Vorgaben



Technische Ausstattung

Auflichtmikroskop - Zeiss Axio Imager.M2m
mit motorischem x/y/z-Trieb und entsprechender Software für Bildanalyse und korrelative Mikroskopie

Zusatzausstattung: Polarisator

Objektive: EC Epiplan 5x/0.13 HD M27
Pixel Skalierung: 0,93 µm/Pixel
Kamera: AxioCamICc1
Auflösung: 1388 Pixel x 1038 Pixel
Software: AxioVision Particle Analyzer
Version: 4.9 (11-2012)

REM - Zeiss EVO® MA10

Beschleunigungsspannung: 0,1 - 30 kV
Vergrößerung: < 5 bis 1.000.000fach

Detektoren:

Sekundärelektronen (SE) –Detektor für den Hochvakuum- und VPSE für den Niedervakuum-Betrieb, Rückstreudetektor (BSE)

EDX - Bruker Quantax 200

Detektor: XFlash® Detektor 410

Nachweisbare Elemente: Bor - Uran

